



1.はじめに

2.新しい入射法

3.SPring-8蓄積リングへの応用

4.電磁石の設計

5.まとめ

はじめに

放射光リングのトップアップ入射時に要請されること

■ 入射効率が高いこと。(80%以上)

■ 蓄積電子ビームの軌道が動かないこと。

目的

- 蓄積電子ビームに影響を与えないで
- 入射電子ビームのエミッタンスを増加させず、超低エミッタンスリングの ようなダイナミックアパーチャの小さなリングでも高い入射効率を確保できる

入射法の開発

従来の入射法 バンプ軌道の形成



問題点

- ・ バンプ軌道の不整合、アンダーシュート、バンプ軌道内の六極電磁石の存在により軌道が動く。[1]
- セプタム壁のため入射ビームのCourant-Snyder 不変量Wが小さくできず、アクセプタンスが小さな リングでは入射効率が低下。

[1] H. Tanaka et al., Nuclear Instruments and Methods in Physic Research, A 529, 547 (2005).

パルス4極1,6極による入射法233



問題点 蓄積ビームが蹴られて動く



問題点 入射ビームに対する蹴り角が一様でなく広がるため、 ダイナミックアパーチャの小さなリングでは入射効率 が低下[4]

- [1] K. Harada et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 10, 123501 (2007).
- [2] Y. Kobayashi, et al., Proc. of EPAC, 2006, 0. 3526.
- [3] H. Takaki et al., Phys. Rev. ST Accel. Beams 13, 020705 (2010).
- [4] Y. Jiao, Workshop on Accelerator R&D for Ultimate Storage Rings, 2012.

理想的な入射 蓄積電子に影響を与えず、入射電子のエミッタンスを増加させない



蓄積電子は動かず、入射電子は広がらない

主磁場

合成磁場

磁板

主キッカー電磁石と補正電磁石で蓄積軌道では 磁場がなく、入射軌道では2極磁場を作成

SPring-8低エミッタンスオプティックス回とキッカー設置可能場所

[1] Y. Shimosaki, et al., Proc. of IPAC2013, p. 133.

位相空間上で偏向電磁石B1、B2の占める位置

キッカーによりP=0の位置に蹴り込んだ後の入射電子ビーム のCourant-Snyder不変量Wと蹴り角の位置依存性

Wが小さくできるXが小さい部分は偏向電磁石 が設置されており、キッカーを置けない 入射ビームの入射角度を変えて キッカー設置場所を検討

入射ビームを+1mrad傾けて入射した場合の 位相空間上で偏向電磁石B1、B2の占める位置

キッカーによりP=+1mradの位置に蹴り込んだ後の入射電子 ビームのCourant-Snyder不変量Wと蹴り角θの位置依存性

入射角が+方向ではXが小さいところは依然として偏向電磁石部となる。

超低エミッタンスリング3

入射ビームを-1mrad傾けて入射した場合の 位相空間上で偏向電磁石B1、B2の占める位置 キッカーによりP=-1mradの位置に蹴り込んだ後の入射電子 ビームのCourant-Snyder不変量Wと蹴り角の位置依存性

入射角が-方向ではXが小さいところで偏向電磁石部を避けることができる。

キッカーを偏向電磁石B2の前に置いた時 とC架台下流に置いた時のキック後の入射 ビームのCourant-Snyder不変量Wの入射ビ ームの入射角依存性 キッカーを偏向電磁石B2の前に置いた時とC架台下流に置いた時に P=0上に蹴り込むためのキック角の 入射ビームの入射角依存性 各キッカーの位置での蹴る 位置Xの入射角依存性

C架台下流CGAにキッカーを置いた方が、Wは 小さくなり蹴り角のも小さくて済む。しかも蹴る位置 Xは大きく取れ中心軌道から離すことが出来る

キッカー設置場所はC架台の下流CGAとし 入射角は-0.7 mradとする。このときXは7.3 mm。

表1入射の主なパラメータ

パラメータ	值
入射位置 X	-7.3 mm
セプタム出口での入射ビームの傾きθ	-0.7 mrad
キッカーの蹴り角日	0.989 mrad
入射後のCourant-Snyder不変量W	1.7×10 ⁻⁶ m•rad
現在のSPring-8のW	3.2×10 ⁻⁶ m•rad(1.9倍)
現在のSPring-8のセプタム壁で決まる アクセプタンスW	11.1×10 ⁻⁶ m•rad

補正電磁石

主電磁石、補正電磁石、合成磁場の分布

中心軌道付近の4極、6極および 本システムの磁場分布の比較 入射点X=7.3mm付近の4極、6極および 本システムの磁場分布の比較

表2 主電磁石の主なパラメータ

パラメータ	值
大きさ	22×30×100 mm
磁極間距離	5 mm
起磁力	1345 AT
磁場強度	0.3343 T
(SPring-8バンプ電磁石BP1EX起磁力)	(12000 AT、約9倍)
(SPring-8バンプ電磁石BP2EX起磁力)	(9600 AT、約7倍)

表3 補正電磁石の主なパラメータ

パラメータ	值
大きさ	25×30×50 mm
磁極間距離	4.72 mm
起磁力	432 AT

16

まとめ

- 蓄積電子に影響を与えず、入射電子ビームのエミッタンスを大きくしない 理想的な入射システムを検討した。
- 理想的な入射ができるのはステップ関数の磁場分布を持つものである。
- 主2極電磁石と補正電磁石を組み合わせればステップ関数に近い磁場分布を 得ることが出来ることが分かった。(まだ中心部に四極成分が残り改善の余地あり)
- SPring-8蓄積リングに本方法を検討し、電磁石を設計した。
- 設計した電磁石は大きさ22×30×100 mmで磁極間距離は5mm、起磁力は 1345ATである。この値はSPring-8蓄積リングバンプ電磁石の約1/9である。
- 本システムによる入射後のCourant-Snyder不変量の値は1.7×10⁻⁶m•radで この値は現在のSPring-8の53%である。
- 電磁石の磁極間距離をさらに1mm程度にすれば2mm程度のダイナミック アパーチャを持つ超低エミッタンスリングにも適用できる可能がある。